

同步辐射, 自由电子激光, 核技术应用等

采样间隔和投影数对SR-XFMT重构质量的影响

邓彪, 余笑寒, 徐洪杰

中国科学院上海应用物理研究所 上海 201800

收稿日期 2006-9-12 修回日期 2006-11-1 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 同步辐射微束X射线荧光CT(SR-XFMT)是一种能无损、高空间分辨和高灵敏地探测样品内部元素含量和分布的新技术. 对SR-XFMT实验进行了计算机模拟, 讨论了采样间隔和投影数对重构质量的影响, 分析发现采样间隔对重构质量的影响比投影数的影响要大.

**关键词** [SR-XFMT](#) [图像重构](#) [采样间隔](#) [投影数](#)

分类号

**DOI:**

通讯作者:

邓彪 [dengbiao@sinap.ac.cn](mailto:dengbiao@sinap.ac.cn)

作者个人主页: 邓彪; 余笑寒; 徐洪杰

## 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(479KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“SR-XFMT”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [邓彪](#)
- [余笑寒](#)
- [徐洪杰](#)